

Program studiów

Elektronika i telekomunikacja drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki



1. Podstawowe informacje o kierunku

Nazwa kierunku studiów	Elektronika i telekomunikacja
Poziom studiów	drugiego stopnia
Profil studiów	ogólnoakademicki

Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku

Nazwa dyscypliny wiodącej	Udział
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne	75 %

Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku

Nazwa dyscypliny	Udział
informatyka techniczna i telekomunikacja	25 %

Liczba semestrów	studia stacjonarne: 3
Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów	90
Łączna liczba godzin zajęć	1145
Wymagania wstępne - rekrutacja	wymagania corocznie określone przez Senat PRz
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy	magister inżynier
Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia	<p>Studia II stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja dają poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Pozwalają na uzyskanie wiedzy o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w elektronice i telekomunikacji (w tym nanotechnologii).</p> <p>Absolwenci potrafią umiejętnie dobrać i wykorzystać nowoczesne środowiska programistyczne oraz metody badawcze do projektowania zaawansowanych urządzeń lub systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, posługują się właściwie dobranymi metodami badawczymi, a także środowiskami programistycznymi, które umożliwiają projektowanie, oprogramowanie i rozwój zaawansowanych urządzeń lub systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>Umożliwiają uczestniczenie w pracach badawczych i rozwojowo-wdrożeniowych w obszarze elektroniki i telekomunikacji, w badaniach zjawisk związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną, układami elektronicznymi analogowymi i cyfrowymi, przetwarzaniem sygnałów. Absolwenci są przygotowani do wdrażania nowych technologii i projektowania innowacyjnych urządzeń oraz złożonych systemów. Dzięki tym umiejętnościom znajdują zatrudnienie w firmach badawczo-rozwojowych wielu przedsiębiorstw.</p>

2. Efekty uczenia się

Symbol	Treść	Odniesienia do PRK
K_W01	Ma pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, wykorzystywaną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji.	P7S_WG
K_W02	Ma pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, wykorzystywaną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji.	P7S_WG
K_W03	Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w elektronice i pokrewnych dyscyplinach naukowych.	P7S_WG
K_W04	Ma wiedzę w zakresie ochrony i zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego.	P7S_WK
K_W05	Ma pogłębioną wiedzę w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów obejmującą m.in. sygnały audio i wideo wykorzystywaną w nowoczesnym sprzęcie i systemach elektronicznych.	P7S_WG
K_W06	Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych.	P7S_WG
K_W07	Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, układów elektronicznych, systemów teletransmisyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w łączności.	P7S_WG

K_W08	Ma pogłębioną wiedzę w zakresie typowych metod i narzędzi służących do projektowania i konstruowania złożonych programowalnych układów cyfrowych.	P7S_WG
K_W09	Ma szczegółową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów, w tym technicznych i antropotechnicznych.	P7S_WG P7S_WK
K_W10	Ma wiedzę w zakresie zasad formułowania problemów decyzyjnych oraz komputerowego wspomaganie decyzji.	P7S_WG
K_W11	Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad projektowania dla jakości i niezawodności urządzeń elektronicznych oraz wymagań norm międzynarodowych dotyczących tej dziedziny.	P7S_WK
K_W12	Posiada szczegółową wiedzę w zakresie układów optyki zintegrowanej, z uwzględnieniem elementów optyki nieliniowej.	P7S_WG
K_W13	Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod badawczych oraz obszarów aplikacji obejmujących mikro- i nanotechnologie, z uwzględnieniem fizyczno-matematycznych podstaw procesów samoorganizacji nanostruktur.	P7S_WG
K_U01	Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji oraz krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.	P7S_UU
K_U02	Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się przy użyciu różnych form przekazu informacji (także w języku angielskim) ze specjalistami w zakresie elektroniki i telekomunikacji oraz z osobami spoza grona specjalistów.	P7S_UK
K_U03	Potrafi przygotować, w języku polskim, opracowanie naukowe oraz, w języku obcym, doniesienie naukowe poświęcone wynikom realizacji zadania badawczego.	P7S_UK
K_U04	Potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego.	P7S_UK
K_U05	Ma umiejętność porozumiewania się w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz czytania ze zrozumieniem: kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.	P7S_UK
K_U06	Potrafi formułować oraz testować hipotezy związane z modelowaniem i projektowaniem układów, urządzeń lub systemów elektronicznych.	P7S_UW
K_U07	Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów lub systemów elektronicznych - ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii oraz rozwiązań o charakterze innowacyjnym.	P7S_UW
K_U08	Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami badawczymi, umożliwiającymi pomiary podstawowych wielkości charakteryzujących zaawansowane układy, urządzenia lub systemy elektroniczne.	P7S_UW
K_U09	Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, umożliwiającymi projektowanie i oprogramowanie zaawansowanych układów, urządzeń lub systemów elektronicznych.	P7S_UW
K_U10	Potrafi przeanalizować sposób funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne układów, urządzeń lub systemów elektronicznych.	P7S_UW
K_U11	Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych układów, urządzeń lub systemów elektronicznych.	P7S_UW
K_U12	Potrafi sformułować specyfikację złożonych oraz nietypowych zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji.	P7S_UW
K_U13	Potrafi ocenić przydatność oraz dostrzec ograniczenia właściwych metod i narzędzi, służących do rozwiązywania charakterystycznych zadań inżynierskich z zakresu elektroniki i telekomunikacji a także - wykorzystując zarówno istniejące jak i koncepcyjnie nowe metody i narzędzia - rozwiązywać zadania złożone oraz nietypowe, zawierające komponent badawczy.	P7S_UW
K_U14	Potrafi - uwzględniając aspekty środowiskowe i ekonomiczne - zaprojektować i zrealizować (w całości lub części) złożony układ, urządzenie lub system elektroniczny, wykorzystując istniejące lub opracowując nowe metody i narzędzia.	P7S_UW
K_U15	Posiada umiejętność opracowania planu badań i przeprowadzenia testów kompatybilności elektromagnetycznej, z uwzględnieniem wymagań zawartych w przedmiotowych standardach.	P7S_UW
K_U16	Posiada umiejętność opisu procesów, tworzenia modeli oraz zapisu i oceny złożoności obliczeniowej algorytmów.	P7S_UW
K_U17	Potrafi zaprojektować układy i urządzenia optoelektroniczne, światłowodowe i fotoniczne.	P7S_UW
K_U18	Potrafi wyznaczyć własności komponentów mikro- i nanostruktur, z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii sił atomowych.	P7S_UW
K_U19	Posiada umiejętność analizowania podstawowych aspektów bezpieczeństwa systemów.	P7S_UW
K_K01	Jest odpowiedzialny za pracę własną i skutki podejmowanych decyzji; potrafi podporządkować się zasadom pracy w grupie w roli lidera i członka zespołu; jest odpowiedzialny za wspólnie realizowane zadania.	P7S_UO P7S_KO
K_K02	Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.	P7S_KO
K_K03	Potrafi zadbać o jakość i staranność wykonywanych zadań.	P7S_KR
K_K04	Potrafi zadbać o poprawność językową formułowanych wniosków i opinii.	P7S_KO P7S_KR
K_K05	Rozumie potrzebę praktycznego stosowania nabytej wiedzy.	P7S_KK

Opis efektów uczenia się zawiera efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i uwzględnienia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w tej ustawie oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy, natomiast w przypadku kierunku studiów kończącego się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera – pełen zakres efektów umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich.

Szczegółowe informacje o:

1. związkach efektów uczenia się z efektami uczenia się zawartymi w poszczególnych zajęciach;
2. kluczowych kierunkowych efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z ukazaniem ich związku z dyscypliną/dyscyplinami, do której/którego kierunku jest przyporządkowany;

- rozwinięciu kierunkowych efektów uczenia się na poziomie zajęć lub grup zajęć, w szczególności powiązanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową;
- efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera;

znajdują się w kartach zajęć, dostępnych na stronie internetowej wydziału.

3. Wykaz zajęć, parametry programu studiów, metody weryfikacji efektów uczenia się oraz treści programowe

3.1 Wykaz zajęć

Semestr	Jedn.	Nazwa zajęć	Wykład	Ćwiczenia/ Lektorat	Laboratorium	Projekt/ Seminarium	Suma godzin	Punkty ECTS	Egzamin	Oblig.
1	EA	Bezpieczeństwo systemów informacyjnych	30	0	15	15	60	3	N	
1	EP	Cyfrowe przetwarzanie sygnałów	30	0	30	0	60	4	T	
1	EM	Diagnostyka i niezawodność	30	0	15	15	60	4	N	
1	DJ	Język angielski w nauce i technice	0	30	0	0	30	3	N	
1	ET	Metody numeryczne	15	15	15	0	45	4	T	
1	ED	Metody obliczeniowe w fizyce i technice	15	15	0	0	30	3	N	
1	EU	Programowalne układy cyfrowe	30	0	30	0	60	4	N	
1	ED	Teoria pola elektromagnetycznego	30	30	0	0	60	5	T	
Sumy za semestr: 1			180	90	105	30	405	30	3	0
2	EU	Kompatybilność elektromagnetyczna	30	15	30	0	75	5	T	
2	EM	Procesy stochastyczne w elektronice	15	0	15	15	45	3	N	
2	EU	Równania różniczkowe cząstkowe w technice	30	30	0	0	60	4	T	
2	EX	Seminarium dyplomowe	0	15	0	0	15	1	N	🚩
2	EU	Technika światłowodowa i fotonika	30	0	15	0	45	3	N	
2	EU	Wstęp do nanotechnologii	30	0	15	0	45	3	T	
2	EU	Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki (w j. angielskim)	10	0	0	20	30	2	N	
2	EX	Zajęcia wybieralne I	30	0	15	0	45	3	N	
2	EX	Zajęcia wybieralne II	30	0	15	0	45	3	N	
2	EU	Zarządzanie jakością	15	0	15	0	30	3	N	
Sumy za semestr: 2			220	60	120	35	435	30	3	1
3	EX	Praca dyplomowa	0	0	0	0	0	10	N	
3	EX	Seminarium dyplomowe	0	15	0	0	15	2	N	
3	ES	Sieci komputerowe	30	0	15	15	60	4	N	
3	EU	Technika radiowej identyfikacji obiektów	30	0	15	15	60	4	T	
3	EP	Wykład monograficzny	15	0	0	0	15	2	N	
3	ZP	Wynalazczość i ochrona patentowa	20	0	0	0	20	2	N	
3	EX	Zajęcia wybieralne III	30	0	15	0	45	2	N	
3	EX	Zajęcia wybieralne IV	30	0	15	0	45	2	N	
3	EX	Zajęcia wybieralne V	30	0	15	0	45	2	N	
Sumy za semestr: 3			185	15	75	30	305	30	1	0
SUMY ZA WSZYSTKIE SEMESTRY:			585	165	300	95	1145	90	7	1

Uwaga, niezaliczenie zajęć oznaczonych czerwoną flagą uniemożliwia dokonanie wpisu na kolejny semestr (nawet wówczas gdy sumaryczna liczba punktów ECTS jest mniejsza niż dług dopuszczalny), są to zajęcia kontynuowane w następnym semestrze lub zajęcia, w których nieosiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się nie pozwala na kontynuowanie studiów w innych zajęciach objętych programem studiów następnego semestru.

3.2 Parametry programu studiów i metody weryfikacji efektów uczenia się

Parametry programu studiów

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia.	46 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów.	49 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne.	5 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom do wyboru.	27 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego.	5 ECTS
Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.	--

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Szczegółowe zasady oraz metody weryfikacji i oceny efektów uczenia się pozwalające na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów uczenia się są opisane w kartach zajęć. W ramach programu weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się jest realizowana w szczególności przy pomocy następujących metod: egzamin cz. pisemna, egzamin cz. praktyczna, egzamin cz. ustna, zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, zaliczenie cz. ustna, esej, kolokwium, sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio), prezentacja projektu, raport pisemny, referat pisemny, referat ustny, sprawozdanie z projektu, test pisemny. Szczegółowe informacje na temat weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się znajdują się w kartach zajęć opublikowanych na stronie internetowej wydziału.

3.3 Treści programowe

Treści programowe (kształcenia) są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają w szczególności aktualny stan wiedzy i metodyki badań w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których jest przyporządkowany kierunek, jak również wyniki działalności naukowej uczelni w tej dyscyplinie lub dyscyplinach. Szczegółowy opis realizowanych treści programowych znajduje się w kartach zajęć, dostępnych na stronie wydziału.

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych	K_W03, K_W09, K_U10, K_U19
<ul style="list-style-type: none"> Bezpieczeństwo informacyjne. Bezpieczeństwo systemu w ujęciu wieloprocesowym. Polityka bezpieczeństwa. Ataki na bezpieczeństwo. Usługi bezpieczeństwa, mechanizmy zabezpieczające. Certyfikacja systemów. Systemy krytyczne ze względu na bezpieczeństwo. Implementacja usług i mechanizmów bezpieczeństwa w systemach technicznych i antropotechnicznych. Podstawy kryptografii. Rodzaje szyfrów. Szyfrowanie klasyczne. Systemy szyfrowania symetryczne blokowe i strumieniowe. Szyfrowanie z użyciem klucza publicznego. Algorytmy kryptograficzne symetryczne i asymetryczne. Kryptografia kwantowa. Metody uwierzytelniania. Podpis elektroniczny. Watermarking i steganografia. Zarządzanie kontrolą dostępu. Programy złośliwe. Zapory sieciowe. Sniffing i scanning. Kopie bezpieczeństwa. Ochrona informacji przesyłanej w sieciach teleinformatycznych (m.in. sieci komputerowe, bezprzewodowe sieci komputerowe). Sieci wirtualne (tunelowanie). Zabezpieczenia transmisji w komputerowych sieciach przemysłowych i rozproszonych systemach sterowania. Oprogramowanie złośliwe w instalacjach przemysłowych. 	
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów	K_W05, K_U08, K_U13
<ul style="list-style-type: none"> Wstęp do Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Systemy liniowe, stacjonarne Przetwarzanie Analogowo-cyfrowe i Cyfrowo-analogowe Podstawowe obiekty fizyczne i ich reprezentacje w dziedzinie czasu oraz dziedzinach s i z Filtry IIR Korelacja i Splot Dyskretne przekształcenie Fouriera Odwrotne przekształcenie Fouriera Właściwości DFT/IDFT Okienkowanie sygnałów Filtry o średniej kroczącej Filtry FIR Porównanie filtrów FIR oraz filtrów IIR Układy cyfrowego sterowania automatycznego 1. Synteza sygnałów dyskretnych i pomiary ich podstawowych parametrów sygnałowych. 2. Implementacja filtrów analogowych w postaci cyfrowych filtrów IIR. 3. Filtry IIR wyższego rzędu. 4. Kolokwium I. (+ poprawa) 5. Korelacja i Splot. 6. Dyskretne przekształcenie Fouriera. 7. Odwrotne, dyskretne przekształcenie Fouriera. 8. Okienkowanie 9. Projektowanie filtrów FIR 10. Kolokwium II. (+ poprawa) 	
Diagnostyka i niezawodność	K_W08, K_W11, K_U10, K_K03, K_K05
<ul style="list-style-type: none"> Wprowadzenie do teorii eksploatacji i diagnostyki technicznej Eksplatacja obiektu i modele systemów eksploatacji Modele diagnostyczne systemów technicznych Wieloprocesowe ujęcie eksploatacji obiektu technicznego Diagnozowanie komparacyjne Modele uszkodzeń i testowanie urządzeń elektronicznych Projektowanie uwzględniające możliwość testowania Teoria niezawodności - pojęcia podstawowe Liczbowe miary niezawodności Struktury niezawodnościowe Projektowanie dla jakości Projektowanie dla niezawodności 	
Język angielski w nauce i technice	K_U05
<ul style="list-style-type: none"> Zbieżności w telekomunikacji i informatyce Charakterystyka urządzeń przENOśnych Oprogramowanie i jego rozwój Praca przedsiębiorstw w sieci Zarządzanie siecią Problemy techniczne związane z pracą w sieci Centra przetwarzania danych Usługi. Rola outsourcingu Rola reklamy w mediach Zestawienie nadawania analogowego z cyfrowym Wykorzystywanie technologii w medycynie Nieprowadzenie i sukcesy technologiczne Ekologiczne aspekty telekomunikacji 	
Kompatybilność elektromagnetyczna	K_W03, K_W06, K_U01, K_U09, K_U15, K_K05
<ul style="list-style-type: none"> Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej; podstawowe pojęcia i definicje, dyrektywy, przepisy i akty prawne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych; wielkości fizyczne i jednostki miary w zakresie EMC. Źródła i mechanizmy powstawania zaburzeń elektromagnetycznych. Mechanizmy propagacji zaburzeń elektromagnetycznych. Podstawowe sposoby przeciwdziałania zaburzeniom elektromagnetycznym (technika uziemiania, ekranowania, filtrowania, separacji, symetryzacji w obwodach elektrycznych i elektronicznych). Projektowanie układów planarnych, interfejsów komunikacyjnych zgodnie z wymaganiami EMC. Integralność sygnałów w układach i interfejsach elektronicznych. Metodyka pomiaru, dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń elektromagnetycznych (przewodzonych i promieniowanych) generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne. Badania odporności urządzeń na znormalizowane rodzaje zaburzeń – metodyka, układy pomiarowe, dopuszczalne poziomy. Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka; strefy ochronne. 	
Metody numeryczne	K_W01, K_W07, K_U13, K_U16, K_K01
<ul style="list-style-type: none"> Wprowadzenie do metod numerycznych. Podstawowe pojęcia. Definicja błędu. Rodzaje błędów. Arytmetyka stało- i zmiennoprzecinkowa. Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Układy liniowych równań algebraicznych: metody dokładne: układy równań z macierzą trójkątną, metoda eliminacji Gaussa, układy z macierzą symetryczną; metody przybliżone: metody 	

Jakobiego, Gaussa, Czebyszewa. • Wartości i wektory własne macierzy: metody ogólne, zastosowanie wielomianu charakterystycznego, algorytm QR dla macierzy Hessenberga. • Interpolacja: interpolacja Lagrange'a i Hermite'a, interpolacja wzorem Newtona, metoda Aitkena; różnice skończone wsteczne, centralne i progresywne, diagram Frasera, funkcje bazowe (wielomiany, funkcje sklepane). • Aproksymacja: aproksymacja średniokwadratowa: wielomiany ortogonalne i trygonometryczne; FFT, aproksymacja jednostajna: metoda szeregów potęgowych, szeregi Czebyszewa. • Całkowanie: definicja kwadratury; kwadratury: Newtona-Cotesa i Gaussa; całkowanie po trójkącie. • Różniczkowanie: przybliżanie pochodnych ilorazami różnicowymi; diagram Frasera; pochodne cząstkowe. • Równania różniczkowe zwyczajne, układy równań: Metoda zmiennych stanu; metody ekstrapolacyjno-interpolacyjne, metody Runge-Kutty.	
Metody obliczeniowe w fizyce i technice	K_W01, K_W02, K_W07, K_U06, K_U13, K_K05
• Szeregi funkcji ortogonalnych, analiza harmoniczna Fouriera • Transformaty Fouriera • Równania różniczkowe liniowe o stałych i zmiennych współczynnikach • Równania różniczkowe cząstkowe - klasyfikacja i przykłady zastosowania w fizyce i technice • Metody rozwiązywania różniczkowych zagadnień granicznych elektrotechniki	
Praca dyplomowa	K_U01, K_U02, K_U03, K_U10, K_U11, K_U14
• Sformułowanie problemu badawczego właściwego dla kierunku studiów. Analiza literatury i istniejących rozwiązań. Analiza wymagań i założeń projektowych lub badawczych. Dobór metod, technologii i narzędzi. Projekt, implementacja, konfiguracja lub realizacja rozwiązania. Testowanie i weryfikacja wyników. Analiza i interpretacja uzyskanych rezultatów. Opracowanie dokumentacji pracy dyplomowej. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.	
Procesy stochastyczne w elektronice	K_W01, K_W02, K_U08, K_K01, K_K03, K_K05
• Zmienne losowe wielowymiarowe. Procesy stochastyczne. Procesy stacjonarne, ergodyczne, gaussowskie. Procesy Markowa. Dyskretne i ciągłe łańcuchy Markowa. Teoria estymacji. Analiza w dziedzinach: czasu, częstotliwości i wartości amplitudowych. Zagadnienia w elektronice z udziałem sygnałów stochastycznych.	
Programowalne układy cyfrowe	K_W03, K_W08, K_U01, K_U12, K_K01, K_K02
• Geneza, status i jego uwarunkowania, rodzaje, architektura, właściwości i zastosowania cyfrowych układów programowalnych (PLD: SPLD i CPLD, FPGA oraz PSoC). Pamięć konfiguracji, konfiguracja bloków logicznych. Bloki specjalizowane. Dystrybucja sygnałów zegarowych, metastabilność. Ogólna charakterystyka systemów projektowania układów. • Przegląd cyfrowych układów programowalnych z oferty wybranych producentów (m.in. Altera, Xilinx, Lattice). • Poziomy abstrakcji w opisie układów cyfrowych, języki opisu sprzętu - ogólna charakterystyka (VHDL, Verilog). Współbieżny i sekwencyjny opis układu, procesy kombinacyjne i sekwencyjne. Maszyny stanów, kodowanie, stany zabronione. Konstrukcje niesyntezywalne. Synteza bloków logicznych. Biblioteki i generatory komponentów. Synteza z ograniczeniami czasowymi i przestrzennymi. Atrybuty, sterowanie syntezą. • Język VHDL i jego zastosowanie w syntezie układów programowalnych - modelowanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych o różnym stopniu złożoności. • Symulacja czasowa i funkcjonalna. Optymalizacja czasowa. Biblioteka systemowa. Ścieżki projektowania. • Oprogramowanie do syntezy i implementacji układów. Charakterystyka wybranych systemów projektowania (Active-HDL, Quartus II): specyfikacja układu, kompilacja i możliwości sterowania nią, weryfikacja i programowanie (metody konfiguracji układów, interfejsy). • Technologia programowania w systemie, testowanie systemów cyfrowych. Programowanie i testowanie w standardzie JTAG: architektura ścieżki krawędziowej, budowa komórki BSC, architektura układów BSC. • Integracja sprzętu i oprogramowania. Procesory w układach programowalnych. Układy typu Structured ASIC. • Oprogramowanie narzędziowe - środowisko projektowe • Projektowanie w systemie Quartus II - wprowadzenie (implementacja gotowego projektu). • Implementacja prostego układu cyfrowego w strukturze CPLD (np. podwójny licznik). • Implementacja złożonego układu cyfrowego w strukturze FPGA (np. licznik rewersyjny) • Implementacja prostej maszyny stanów (np. układ wykrywania sekwencji). • Implementacja złożonej maszyny stanów (np. automat do gry). • Zaliczenie wiadomości z projektu i ćwiczeń laboratoryjnych	
Równania różniczkowe cząstkowe w technice	K_W01, K_W02, K_U04, K_K05
• Równania różniczkowe cząstkowe I rzędu, podstawowe pojęcia, metody rozwiązywania • Równania różniczkowe cząstkowe II rzędu, podstawowe pojęcia, klasyfikacja, typy, przykłady • Wybrane metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych • Pola skalarne i wektorowe - właściwości. Równania Maxwella • Wybrane zagadnienia techniczne opisywane równaniami różniczkowymi II rzędu (zagadnienia z elektrotechniki, mechaniki, ciepła); Formułowanie problemu i rozwiązywanie.	
Seminarium dyplomowe	K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07
• Wymagania formalne i redakcyjne pracy dyplomowej. Struktura pracy, podział treści na rozdziały i podrozdziały. • Zasady tworzenia części teoretycznej i praktycznej pracy. • Prezentacja części teoretycznej i praktycznej pracy. Dopracowanie spisu treści, tezy, celu, zakresu.	
Sieci komputerowe	K_W03, K_W07, K_W09, K_U01, K_U10, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05
• Zajęcia organizacyjne. ustalenie formy zaliczenia i zakresu materiału. Zapoznanie z zasadami pracy w laboratorium. • Podstawy transmisji. Geneza i klasyfikacja sieci komputerowych. • Adresy fizyczne MAC. Adresacja IPv4 oraz IPv6. • Topologie sieci komputerowych: Pojęcie topologii. Podstawowe parametry topologii sieci komputerowych. Przykładowe topologie sieci i ich zastosowanie • Elementy architektury sieci komputerowych, ich funkcjonalność oraz przeznaczenie. • Model warstwowy ISO/OSI i TCP/IP. • Istota działania sieci VLAN oraz mechanizmy przełączania. • Istota działania protokołów drzewa rozpinającego. • Media transmisyjne w sieciach komputerowych. Najważniejsze parametry medium transmisyjnego. Klasyfikacja mediów. Media przewodowe i bezprzewodowe. Kable światłowodowe. Kable miedziane. • Podstawy routingu w sieciach komputerowych. Routing statyczny oraz dynamiczny. Protokoły routingu wektora odległości i stanu łącza. • Analiza funkcjonowania kompleksowej sieci komputerowej - studium przypadku z uwzględnieniem aspektów zarządzania ryzykiem.	
Technika radiowej identyfikacji obiektów	K_W01, K_W06, K_W07, K_U01, K_U08, K_K01
• Wprowadzenie do techniki radiowej identyfikacji obiektów • Uwarunkowania funkcjonowania systemów RFID • Elementy systemów RFID (identyfikator, cztnik/programator, antena czytnika/programator, oprogramowanie systemowe itp.) • Regulacje prawne • Przykłady aplikacyjne i osiągnięcia naukowe (systemy pasm LF, HF, UHF, Internet rzeczy, Industry 4.0 itp.) • Wprowadzenie • Zapoznanie się z wyposażeniem stanowiska laboratoryjnego (sprzęt, oprogramowanie, literatura) • Zapoznanie się z budową, funkcjonowaniem i aplikacjami wybranych systemów RFID pasm LF, HF, UHF (UNIQUE, HITAG, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443, MIFARE, ICODE, ISO/IEC 18000-63 itp.) • Podsumowanie • Projekt	

Technika światłowodowa i fotonika	K_W03, K_W12, K_U01, K_U17, K_K03
<p>• Fotonika, optyka a elektronika. Światło jako ruch falowy. Podstawy optyki fotonów. Podstawy optyki geometrycznej. Źródła światła dla techniki światłowodowej. Lasery. • Propagacja światła w wolnej przestrzeni, w światłowodach planarnych, paskowych i włóknistych. Wytwarzanie włókien i kabli światłowodowych, metody pomiaru parametrów włókien i łączyc światłowodowych. Światłowody nitelekomunikacyjne - specjalne i fotoniczne. • Układy optyki zintegrowanej. Sprzęgacze światłowodowe, siatki Bragga, soczewki, modulatory, polaryzatory, kontrolery i konwertery polaryzacji. Światłowodowe wzmacniacze optyczne. Elementy optyki nieliniowej. Struktury fotoniczne i kwantowe.</p>	
Teoria pola elektromagnetycznego	K_W01, K_W02, K_U16, K_K03
<p>• Matematyczne podstawy teorii pola • Fundamentalne pojęcia i prawa elektrodynamiki • Klasyczne warunki brzegowe elektrodynamiki • Potencjały elektrodynamiczne • Twierdzenie Poyntinga • Statyczne zagadnienia elektromagnetyzmu • Harmoniczne i quasi-stacjonarne pole elektromagnetyczne</p>	
Wstęp do nanotechnologii	K_W03, K_W13, K_U01, K_U18, K_U19, K_K03
<p>• Definicje, istota i ogólna charakterystyka nanotechnologii, podstawy matematyczne modelowania i syntezy. • Mikro/nano-struktury: podstawowe materiały (półprzewodniki, metale, materiały grupy III-V, ferroelektryki, materiały polimerowe, nanorurki węglowe, nanoprzewody), nano-przyrządy i zespoły (molekularne przełączniki i bramki logiczne, przyrządy półprzewodnikowe), technologie wytwarzania (podstawowe techniki i procesy produkcji mikro- i nanostruktur, metody obróbki i kształtowania struktur. • Struktury MEMS i NEMS: rodzaje, metody wytwarzania, aplikacja. Mikroskopia skaningowa: istota, zasada działania, mikroskopia sił atomowych (MSA) i molekularnych, mikroskopia niskotemperaturowa, dynamiczna MSA). • Wybrane zagadnienia nanotrybologii i nanomechaniki: skaningowe badania mikroskopowe materiałów i struktur mikro- oraz nanotrybologicznych, nanoreologia molekularnych warstw cienkich, nanoskalowe procesy adhezji komponentów mikro- i nanomechanicznych, siły tarcia i procesy zużycia w skali atomowej. Molekularne warstwy grube w procesach smarowania: podstawowe materiały, własności, metody badań, samo syntezujące się struktury wielowarstwowe dla kontroli adhezji, ścierania i zużycia komponentów struktur. • Przemysłowe i naukowe obszary aplikacji oraz niezawodność mikro-przyrządów: systemy pamięci na bazie MSA, mikrosystemy napędowe (mikroaktuatory systemów MEMS/NEMS), termo- i elektromechaniczne struktury cienkowarstwowe, systemy sensorowe, opakowania, hermetyzacja, konserwacja próżniowa, procesy przetwórcze, i in.</p>	
Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki (w j. angielskim)	K_U02, K_U04, K_K04
<p>• Wybrane zagadnienia dotyczące elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji • Wybrane zagadnienia związane z architekturą komputerów oraz ich działaniem</p>	
Wykład monograficzny	K_W03, K_W13, K_U01, K_K05
<p>• Przedmiot poświęcony jest pogłębionemu, problemowemu spojrzeniu na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce projektowania nowoczesnych układów elektronicznych i telekomunikacyjnych. W ramach wykładu omawiane są rzeczywiste przykłady projektowe – od identyfikacji problemu inżynierskiego, poprzez sformułowanie modelu matematycznego i dobór odpowiednich narzędzi analitycznych, aż po syntezę, optymalizację i dostrojenie układu fizycznego. Szczególny nacisk położony jest na zrozumienie zależności pomiędzy teorią obwodów, modelowaniem matematycznym, symulacją komputerową i implementacją sprzętową, a także na krytyczną analizę uzyskanych wyników i ich interpretację w kontekście zastosowań praktycznych. Charakter monograficzny przedmiotu umożliwia elastyczne dostosowanie szczegółowych tematów do aktualnych trendów technologicznych, potrzeb rynku pracy oraz zainteresowań studentów, co pozwala na prezentowanie różnorodnych studiów przypadków, obejmujących zarówno klasyczne rozwiązania analogowe i cyfrowe, jak i ich współczesne implementacje w systemach pomiarowych, energetycznych, telekomunikacyjnych czy automatyki. W trakcie zajęć studenci poznają rolę zaawansowanych procesów badawczo-rozwojowych w rozwoju elektroniki i telekomunikacji, ucząc się identyfikowania problemów wymagających pogłębionej analizy, planowania eksperymentów oraz integrowania wiedzy z różnych obszarów inżynierii. Omawiane przykłady ukazują również znaczenie współpracy między środowiskiem naukowym a przemysłem, podkreślając zjawisko synergii pomiędzy nauką i gospodarką oraz rolę innowacji technologicznych w rozwoju społecznym i ekonomicznym.</p>	
Wynalazczość i ochrona patentowa	K_W04, K_U01, K_K02
<p>• Pojęcie własności intelektualnej i jej ochrona • Ochrona dóbr niematerialnych w prawie własności intelektualnej • Dobra o charakterze technicznym : wynalazek ,wzór użytkowy ,topografia układów scalonych. • Rozwiązania o charakterze estetycznym : wzory przemysłowe • Oznaczenia stosowane w obrocie gospodarczym: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne . • Patenty ich ochrona ,zdolność patentowa ,wyłączenia • Analiza dokumentacji patentowej • Procedury krajowe i międzynarodowe-ogólna charakterystyka postępowań patentowych • Umowy licencyjne i inne umowy transferu technologii w świetle europejskiego i polskiego prawa konkurencji • Prezentacje</p>	
Zarządzanie jakością	K_W10, K_W11, K_U14, K_K03
<p>• Wprowadzenie do teorii jakości Współczesne postrzeganie i koncepcja jakości. Klasy jakości, zagadnienie niezawodności. Ewolucyjne zmiany w podejściu do zagadnień jakości. Podstawy filozofii zarządzania przez jakość (Total Quality Management – TQM) • Zarządzanie jakością poprzez przestrzeganie uznanych standardów Wymagane właściwości wyrobu. Normalizacja i cele norm. Organizacje normalizacyjne. Normy z rodziny PN-EN ISO 9000; Model systemu zarządzania jakością. Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Proces certyfikacji. • Zarządzanie bezpieczeństwem produktów Ocena zgodności wyrobów – znak CE. Dyrektywa LVD i EMC • Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością Narzędzia jakościowe opisowe: schemat blokowy, plan działania, sieć działań. Narzędzia jakościowe kreatywne: diagram Ishikawy, diagram podobieństwa, diagram relacji, diagram systematyki, macierzowa analiza danych, burza mózgów. Narzędzia ilościowe: arkusz kontrolny, diagram Pareto. Narzędzia statystyczne: zbieranie danych, histogram, analiza wariancji, analiza regresji karty kontrolne, SPC, zdolność jakościowa procesu. • Metody wspomagające zarządzanie jakością Analiza przyczyn i skutków wad FMEA. Rozwinięcie funkcji jakości QFD Planowanie eksperymentów DOE, Koncepcja Six Sigma.</p>	
Akustyka środowiska	K_W02, K_U15
<p>• Wiadomości ogólne: matematyczny opis fali, fale akustyczne, dźwięki, hałas, kryteria podziału fal akustycznych, pole akustyczne, parametry pola, zależności energetyczne, energia fali, moc, natężenie dźwięku, poziomy wielkości akustycznych. • Źródła fal akustycznych: klasyfikacja źródeł, kryteria klasyfikacji, teoretyczne źródła dźwięku, źródła mechaniczne, elektryczne i</p>	

<p>technologiczne, źródła aerodynamiczne. • Podstawowe zjawiska falowe: promieniowanie i propagacja dźwięku w wolnej przestrzeni, odbicie fal, zjawisko echa, dyfrakcja, ugięcie i rozproszenie, interferencja fal, pochłanianie dźwięku przez środowisko i przez materiały porowate. • Matematyczny opis zjawisk falowych: równanie falowe i równanie Helmholtza. • Matematyczny opis zjawisk falowych: równanie falowe i równanie Helmholtza. Analiza sygnałów akustycznych: analiza w dziedzinie częstości, analiza falkowa, analiza w dziedzinie amplitud, analiza w dziedzinie czasu, równanie Wienera-Chinczyna. • Elementy psychoakustyki: prawo Webera-Fechnera, poziom ciśnienia akustycznego, obszar słyszalności dźwięku, pasma częstotliwości, prawo Ohma, głośność tonu i dźwięku złożonego. • Metody obniżenia poziomu hałasu: tłumiki, obudowy dźwiękochonne-izolacyjne, kabiny dźwiękoszczelne, ekrany akustyczne. • Materiały, ustroje i wyroby dźwiękochonne. • Pomiar podstawowych wielkości akustycznych, komora bezchłowa i pogłosowa.</p>	
Cyfrowe przyrządy pomiarowe	K_W02, K_U10, K_K05
<p>• Podstawowe zasady cyfrowych pomiarów oraz podstawowe składowe struktury cyfrowych przyrządów pomiarowych • Systematyzacja podstawowych operacji przetwarzania analogowo-cyfrowego. • Cyfrowe mierniki okresu, częstości i fazy autonomiczne i wirtualne na bazie kart pomiarowych DAQ • Zwiększenie dokładności cyfrowego pomiaru okresu, częstości i fazy. Tłumienie zakłóceń podczas pomiaru okresu, częstości i fazy • Cyfrowe woltomierze, amperomierze DC oraz omomierze. Tłumienie zakłóceń w cyfrowych przyrządach pomiarowych. • Automatyczna korekcja oddziaływań systematycznych podczas pomiarów cyfrowych • Procesorowe cyfrowe przyrządy pomiarowe • Cyfrowe mierniki parametrów sygnałów AC autonomiczne i wirtualne na bazie kart pomiarowych DAQ. Cyfrowe uśrednianie wagowe. • Cyfrowe watomierze sygnałów AC. Cyfrowy pomiar parametrów mocy na bazie kart pomiarowych DAQ • Cyfrowe mierniki parametrów obwodów elektrycznych autonomiczne i wirtualne na bazie kart pomiarowych DAQ. • Podstawowe składowe niepewności cyfrowych pomiaru, oraz zestawienie podstawowych charakterystyk metrologicznych cyfrowych przyrządów pomiarowych.</p>	
Diagnostyka sprzętu komputerowego	K_W03, K_W09, K_U01, K_U10, K_K01, K_K05
<p>• Normy, organizacje standaryzujące testowanie systemów komputerowych. • Warsztat diagnostyczny. Sprzętowe i programowe metody testowania poszczególnych komponentów systemu komputerowego. • Metody pomiaru wydajności systemu komputerowego. Wzorcowe programy testowe.</p>	
Integralność sygnałów	K_W01, K_W05, K_W06, K_W10, K_U08, K_U10, K_K04
<p>• Problematyka integralności sygnałów • Charakterystyka sygnałów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstości • Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych planarnych i przewodowych struktur transmisyjnych • Wpływ parametrów elementów pasywnych struktur transmisyjnych na proces propagacji sygnałów cyfrowych • Techniki analizy parametrów elementów pasywnych w układach planarnych PCB • Technika analizy parametrów elementów pasywnych w interfejsach komunikacyjnych • Efekt deformacji sygnału w wybranych strukturach transmisyjnych i techniki jego ograniczenia • Efekt przesłuchu w sprzężonych strukturach transmisyjnych • Analizy integralności sygnałów przy wykorzystaniu wybranych pakietów programowych wspomagających projektowanie układów elektronicznych.</p>	
Metody numeryczne w technice	K_W01, K_U04, K_U13
<p>• Przegląd równań różniczkowych zwyczajnych, układy równań. Metoda zmiennych stanu. • Przegląd równań różniczkowych cząstkowych: równania Laplace'a i Poisson'a; równanie przewodzenia ciepła (równanie dyfuzji); równanie falowe, równania biharmoniczne i bifalowe; równania Maxwell'a. • Przegląd równań całkowych Voltery i Fredholma. • Rodzaje sformułowań zagadnień granicznych: klasyczne, wariacyjne: silne, słabe i odwrotne. • Różnice skończone, ilorazy różnicowe (rodzaje), metoda różnic skończonych (FDM). • Metoda elementów skończonych (FEM): funkcje kształtu, wyprowadzenie równoważnego układu równań algebraicznych, analiza, zastosowanie. • Metoda elementów brzegowych (BEM): wyprowadzenie równoważnego układu równań algebraicznych, analiza, zastosowanie. • Metoda Trefftza: T-funkcje, metoda Trefftza-Herrery, metoda Trefftza-Jirouska, metoda Trefftza-Kupradze. • Przegląd metod brzegowych hybrydowych. • Zastosowanie metod numerycznych w telekomunikacji: pole elektrostatyczne, zagadnienie brzegowe teorii rozchodzenia się dźwięku, zagadnienia brzegowe teorii pola elektromagnetycznego.</p>	
Metody optymalizacji	K_W01, K_W10, K_U12, K_U13
<p>• Formułowanie zadań optymalizacji. • Programowanie liniowe: sformułowanie problemu, graficzna interpretacja rozwiązania, szkielet metody simpleks, wykorzystanie przyborników MATLAB-a i Excel-a • Typowe przykłady zastosowania programowania liniowego: wybór asortymentu produkcji, przydział maszyn, zadanie transportowe, optymalizacja na sieciach - zadanie maksymalnego przepływu, zadanie najtańszego przepływu, zadanie najkrótszej drogi, wyznaczenie ścieżki krytycznej • Programowanie w liczbach całkowitych: sformułowanie, metoda podziału i oszacowań, wykorzystanie przyborników MATLAB-a i Excel-a, typowe przykłady - plecak przemysłowy, aukcja kombinatoryczna, harmonogramowanie zadań wykorzystujących ograniczone zasoby, wyznaczenie ścieżki krytycznej • Podstawy teoretyczne optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń • Najważniejsze metody numeryczne optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń, funkcje MATLAB-a i Excel-a • Podstawy teoretyczne optymalizacji statycznej z ograniczeniami • Metody obliczeniowe optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami, funkcje MATLAB-a i Excel-a • Problem optymalizacji globalnej i złożoności obliczeniowej, algorytm genetyczny: podstawowe operacje, zastosowanie przyborników MATLAB-a i Excel-a, typowe przykłady, inne ważne metody inteligencji obliczeniowej • wieloetapowe problemy decyzyjne, metoda programowania dynamicznego • Wprowadzenie do optymalizacji wielokryterialnej: sformułowanie, optymalność w sensie Pareto, wybrane sposoby skalaryzacji, przykład-wielokryterialne zadanie najkrótszej drogi. Metoda AHP</p>	
Nanoelektronika	K_W02, K_U01, K_U11, K_U18, K_K05
<p>• Definicje, istota i ogólna charakterystyka nanotechnologii, podstawy matematyczne modelowania i syntezy. • Mikro/nano-struktury: podstawowe materiały (półprzewodniki, metale, materiały grupy III-V, ferroelektryki, materiały polimerowe, nanorurki węglowe, nanoprzewody), nano-przyrządy i zespoły (molekularne przełączniki i bramki logiczne, przyrządy półprzewodnikowe), technologie wytwarzania (podstawowe techniki i procesy produkcji mikro- i nanostruktur, metody obróbki i kształtowania struktur. • Materiały dla nanoelektroniki, produkcji i techniki pomiarowych dla nanostruktur, produkcji i techniki pomiarowych dla nanostruktur, transportu elektronów w półprzewodnikach i nanostrukturach, elektronów w tradycyjnych strukturach niskowymiarowych, nanourządzeń. • Mikro- i nanomanipulacja, podstawowe techniki mikromontażu, techniki kontroli mikro-siły, narzędzie do mikromontażu, mikro- i nanorobotyka. • Przemysłowe i naukowe obszary aplikacji oraz niezawodność mikro-przyrządów: systemy pamięci na bazie MSA, mikrosystemy napędowe (mikroaktuatory systemów MEMS/NEMS), termo- i elektromechaniczne struktury cienkowarstwowe, systemy sensorowe, opakowania, hermetyzacja, konserwacja próżniowa, procesy przetwórcze, i in.</p>	

Opracowanie wyników eksperymentu pomiarowego	K_W01, K_U06, K_U09
<ul style="list-style-type: none"> • Podstawowe cele i zadania opracowania wyników pomiaru. • Źródła niedoskonałości pomiarów, ich modele i sposoby opisu. • Błąd a niepewność wyniku pomiaru: podobieństwo i różnicy. • Klasyfikacja składowych niepewności, metody obliczania niepewności metodami typu A oraz typu B. • Ocena standardowej niepewności metodą typu A według zaleceń GUM. • Korekcja oddziaływań systematycznych oraz ocena niepewności ich wpływu. • Ocena instrumentalnej składowej niepewności metodą typu B. • Ocena standardowych niepewności od wpływu wielkości wpływających. • Obliczanie niepewności złożonej oraz rozszerzonej. • Opracowanie wyników pomiarów pośrednich z jednokrotnym i wielokrotnym pomiarem wartości argumentów oraz ocena ich niepewności. • Ocena niepewności współczynników oraz prognozowanych wartości funkcji aproksymacji wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów • Wykorzystanie metody Monte-Carlo do analizy niepewności wyników pomiaru • Ocena standardowej niepewności metodą typu A przy rozkładach prawdopodobieństwa wyników obserwacji innych niż normalny. 	
Programowanie współczesnych przyrządów pomiarowych	K_W03, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K05
<ul style="list-style-type: none"> • Język SCPI - właściwości, struktura, wykorzystanie do programowania przyrządów pomiarowych. • Testowy język skryptowy - właściwości, struktura, wykorzystanie do programowania przyrządów pomiarowych. • Wykorzystanie języków wysokiego poziomu do programowej obsługi przyrządów pomiarowych. • Projektowanie aplikacji wykorzystujących możliwości funkcjonalne współczesnych zasilaczy. • Projektowanie aplikacji wykorzystujących możliwości funkcjonalne współczesnych generatorów funkcyjnych. • Projektowanie aplikacji wykorzystujących możliwości pomiarowe współczesnych oscyloskopów cyfrowych. • Projektowanie aplikacji wykorzystujących możliwości pomiarowe współczesnych multimetrów cyfrowych. • Projektowanie aplikacji wykorzystujących możliwości pomiarowe współczesnych częstotliwościomierzy-czasomierzy cyfrowych. 	
Projektowanie współczesnych obwodów drukowanych	K_W08, K_U09, K_U13, K_K03, K_K05
<ul style="list-style-type: none"> • Charakterystyka współczesnych zintegrowanych pakietów do projektowania obwodów drukowanych. • Tworzenie zintegrowanych zbiorów bibliotecznych (otwory, pola kontaktowe, połączenia międzywarstwowe, obudowy elementów itp.) • Generalne zasady projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych. • Szczegółowe zasady projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych z uwzględnieniem integralności sygnałowej i zasilania. • Szczegółowe zasady projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych z uwzględnieniem aspektów cieplnych (rozkłady pola temperatury). 	
Sensory i systemy elektroniczne	K_W02, K_W08, K_U01, K_U08, K_K03
<ul style="list-style-type: none"> • Właściwości statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych. Czujniki wielkości nieelektrycznych. Elektryczne i elektroniczne układy przetwarzające. Układy normalizacji sygnału. Procesy i układy modulacji i demodulacji w torach pomiarowych. Przetwarzanie A/C. Odtwarzanie sygnałów 	
Serwerowe systemy Windows	K_W03, K_U19, K_K05
<ul style="list-style-type: none"> • Wdrażanie i zarządzanie systemem operacyjnym Windows Server. • Wprowadzenie do usługi domenowej Active Directory (ADDS). • Zarządzanie obiektami usługi domenowej Active Directory. • Implementacja adresowania IPv4 w infrastrukturze organizacji. • Implementacja adresowania IPv6 w infrastrukturze organizacji. • Implementacja protokołu DHCP w infrastrukturze organizacji. • Implementacja protokołu DNS w infrastrukturze organizacji. • Konfiguracja usług plików i wydruku. • Zabezpieczanie serwerów pracujących w oparciu o Windows Server w oparciu o mechanizmy filtrowania ruchu. • Usługi wirtualizacji systemu Windows Server. 	
Systemy doskonalenia jakości	K_W10, K_W11, K_U15, K_K01
<ul style="list-style-type: none"> • Początki statystycznego sterowania jakością. Wprowadzenie kart kontrolnych przez Waltera Shewharta. • Zasada diagramu Pareto i strategia Deminga • Projektowanie kart kontrolnych przeznaczonych do oceny wartości liczbowych • Projektowanie kart kontrolnych przeznaczonych do oceny alternatywnej • Podstawowe wskaźniki oceny zdolności procesów do wytwarzania wyrobów zgodnych ze specyfikacją • Zaawansowane metody oceny zdolności procesów do wytwarzania wyrobów zgodnych ze specyfikacją • Zasady doskonalenia jakości metodą "Six Sigma". Główne fazy zespołowej realizacji projektów. (DMAIC) • Nowoczesne metody doskonalenia jakości w przemyśle lotniczym. (AEC) 	
Zaawansowane techniki CAD	K_W08, K_U09, K_U13, K_K03, K_K05
<ul style="list-style-type: none"> • Charakterystyka współczesnych zintegrowanych pakietów do projektowania układów i systemów elektronicznych. • Metody i narzędzia do projektowania układów i systemów elektronicznych. • Modelowanie własności podzespołów i układów elektronicznych (modele SPICE, Verilog, IBIS, itp.) . • Projektowanie układów analogowo-cyfrowych z uwzględnieniem zagadnień cieplnych i kompatybilności elektromagnetycznej (integralność sygnałowa). 	
Zintegrowane systemy mikroprocesorowe	K_W03, K_W08, K_U01, K_U12, K_K01, K_K02
<ul style="list-style-type: none"> • Ogólna charakterystyka architektury typu SoC (System on Chip) • Budowa i zasada działania wybranego rdzenia mikroprocesorowego SoC • Programowanie wybranego rdzenia mikroprocesorowego SoC • Konfigurowanie bloków funkcjonalnych SoC • Obsługa i konfiguracja złożonych systemów wejścia / wyjścia (np. wyświetlacze LCD znakowe i graficzne, klawiatury, czujniki różnych wielkości fizycznych, silniki, elementy wykonawcze) • Rozbudowa systemu mikroprocesorowego o system transmisji danych (np. IIC, Bluetooth, IrDA) • Systemy z wieloma strukturami programowalnymi • Środowisko projektowe dla SoC • Programowanie SoC • Obsługa złożonych układów wejścia - wyjścia • Rozbudowa systemu mikroprocesorowego - zintegrowane struktury programowalne • Zaliczenie wiadomości z projektu i ćwiczeń laboratoryjnych 	